

計測分析に関する講演会 「固体材料の微小領域解析事例」 ～透過電子顕微鏡、走査電子顕微鏡～

開催のご案内

主催:あいち産業科学技術総合センター

共催:(公財)科学技術交流財団

今年2月14日、次世代ものづくり技術の創造・発信の拠点である「知の拠点」に、「あいち産業科学技術総合センター」がオープンしました。当センター本部には、種々の高度分析機器が整備され、企業の研究開発・製品開発の支援のため利用されています。

このたび整備した機器のうち、透過電子顕微鏡（TEM）と走査電子顕微鏡（SEM）による固体材料の微小領域解析に焦点を当てた講演会を、当センター本部にて12月7日（金）に開催します。TEMは、金属やセラミックス、半導体などの材料内部の組織や形態、結晶構造を観察し、材料解析を行うために有用な装置です。また、SEMは、金属やセラミックス、プラスチックなどの材料表面の形状や組成などを観察し、解析するために有用な装置です。

本講演では、企業の開発、不良解析の一助となるような、TEM、SEMを用いた観察・分析事例を詳しくご紹介いたします。

講演後には、当センターの分析機器の紹介と見学会、及び隣接する中部シンクロトロン光利用施設（仮称）の見学会を行います。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【日 時】平成24年12月7日（金） 午後1時30分～午後4時40分

【場 所】あいち産業科学技術総合センター本部 講習会室

愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8315

【プログラム】

| 時間 | 内容 |
|---------------|--|
| 13:00 ～ 13:30 | 受付 |
| 13:30 ～ 13:40 | 開会の挨拶 |
| 13:40 ～ 14:40 | 「透過電子顕微鏡（TEM）の基礎的事項と応用例」 大阪大学 超高压電子顕微鏡センター 特任教授 <small>もり ひろたろう</small> 森 博太郎氏 |
| 14:50 ～ 15:50 | 「走査電子顕微鏡（SEM）による先端材料向け最新解析技術」 株式会社日立ハイテクノロジーズ モノづくり統括本部 グローバルアプリケーションセンタ センタ長 <small>たもち りゅういちろう</small> 多持 隆一郎氏 |
| 16:00 ～ 16:40 | 施設見学（希望者のみ） ・ 共同研究支援部 計測分析室 ・ 中部シンクロトロン光利用施設（仮称） |

■ **申込方法** 下記の申込書にご記入の上、FAX、郵送または電子メールでお送りください。

■ **申込期限** 平成24年12月6日（木）

■ **参加費** 無料

■ **定員** 100名（先着順）

■ **交通のご案内**

- ・ 東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ・ 猿投グリーンロード八草 IC から西へ約 800 m

■ **申込及び問合せ先**

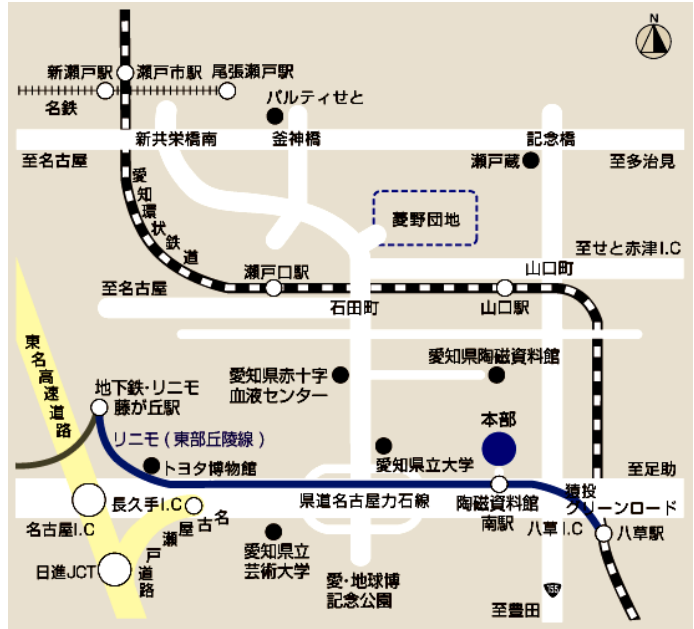
あいち産業科学技術総合センター
共同研究支援部 計測分析室 鈴木、加納

〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1

電話：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317

メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

U R L：http://www.aichi-inst.jp/



計測分析に関する講演会「固体材料の微小領域解析事例」
参加申込書

平成 年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 計測分析室 鈴木、加納 宛
FAX：0561-76-8317 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

| | |
|----------------------------|---------|
| ふりがな | |
| 企業名 | |
| 所在地 | 〒 |
| ふりがな | |
| 所属・氏名 | |
| 連絡先 | TEL FAX |
| | メールアドレス |
| 見学会への参加 (どちらかに○をつけて下さい) | 参加 不参加 |

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

※受講票は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」の配信新規登録希望の場合は、チェックしてください。